

Псевдоисчерпывающее тестирование ОЗУ

Ярмолик В. Н. ¹,

Мрозек И. (Foreign) ²,

Леванцевич В. А. ³

2017

^{1, 3} Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

² Foreign

Ключевые слова: динамические оперативные запоминающие устройства, маршевый тест, псевдо-исчерпывающий тест.

Аннотация:

Анализируются методы тестирования современных запоминающих устройств. Показывается обоснованность применения псевдо-исчерпывающих тестов для обнаружения сложных неисправностей памяти. Формулируется необходимое условие генерирования псевдо-исчерпывающего теста для заданного количества ячеек запоминающего устройства.

Источник публикации:

Информатика. – 2017. – № 2 (54). – С. 58-69.

Интернет-ссылка на статью:

http://depository.basnet.by/EDNI/Periodicals/Articles/Details.aspx?Key_Journal=32&Id=1036.